2007年3月28日(水) 日本物理学会 2007春季大会 @ 首都大学東京

J-PARCにおけるK中間子へリウム3原子 3d→2p X線精密測定実験の計画

理研 岡田 信二

for J-PARC EI7 collaboration

J-PARC EI7 Collaboration

🍚 理化学研究所 :

飯尾雅実,板橋健太,岩崎雅彦,松田恭幸, 大西宏明,岡田信二(Technical coordinator), 應田治彦(Co-spokesperson),佐久間史典, 鈴木隆敏,友野大,山崎敏光

🝚 東京大学 :

早野龍五(Spokesperson),石川隆,竜野秀行

🍚 高エネルギー加速器研究機構 :

石元茂, 鈴木祥仁

🝚 東京工業大学 :

福田芳之,佐藤将春

🝚 東京理科大学 :

千葉順成,花木俊生

🭚 ステファンマイヤー研究所 (オーストリア) :

- P. Buehler, M. Cargnelli, A. Hirtl,
- 石渡智一, P. Kienle, J. Marton,
- E. Widmann, J. Zmeskal

Sector Strain Stra

- D. Pietreanu, D. Sirghi, F. Sirghi
- 🍚 ソウル大学 (韓国) :

H. Bhang, S. Choi, H. Yim

ジィクトリア大学 (カナダ): G. Beer



Introduction





K中間子へリウム3原子の最終軌道(2p)のシフトを ~2eVの精度で決定すること



S-⁴Heの結果(E570)及び理論(赤石計算)との比較:
 K-ヘリウム間のポテンシャルの深さ
 K中間子原子核の存在

● シンプルな系における、K中間子-原子核間の強い相互作用
 のアイソスカラー/ベクター部に関する新たな知見

<u>K-³HeとK-⁴He:Coupled-channel 計算</u>



<u>K中間子原子核の存在に関する重要な情報</u>

赤石・山崎の計算:K中間子の深い束縛状態を予言

K-^{3,4}He間の(強い相互作用の)ポテンシャル実部







ビームライン

<u>KI.8BR ビームライン</u>







KI.8BRにおけるスピル当たり の静止K-の収量の計算結果 (TURTLE + Sanford-Wang)

750MeV/c付近を用いる (E570で用いた650MeV/c入射からのK収量と大きな差はない)





トリガーロジック: (K_{STOP} ⊗ CDH ⊗ SDD) ⊕ (SDD_{self trig.})

($K_{\text{STOP}} = \overline{\text{LC}} \otimes \text{TI} \otimes \text{T0} \otimes \overline{\text{K}_{\text{DECAY}}\text{VETO}} \otimes \overline{\text{BEAMVETO}}$)

- 期待されるトリガーレートは、 • Kstop⊗CDH⊗SDD = 数/spill
- SDD_{self trig.}=数百/spill

<u>X線検出器 (SDD)</u>



KETEK SDD プロトタイプ (100mm²): E570で使用

(現在12台所有)

セラミック (SDDサポートの熱収縮等 により、破壊されやすい)

パッケージ化



スリムライン コンポーネント

KETEK VITUS SDD アレー



2pのシフトを~2eVの精度で決定するために







フラッシュADCを用いたパイルアップ事象の除去









E570 statistics : 3d->2p | 500events for ~20 days (w/ 8 SDDs) → K-yield : x 2 → SDD acceptance : x 3 ⇒ 3.5 days (w/ 8 SDDs)

~2eV(E570と同等)の統計を得るには...

	K1.8BR の場合
プロダクション (最大強度: 30GeV-9µA)	3.5日
コミッショニング	10 日 ※

※検出器に対するコミッショニング 新規ビームラインの調整期間は別途必要

ビーム強度が一桁弱い場合においても、 ーヶ月程度(35日)でデータ収集が可能

➡ "DAY-I"実験として申請
 ➡ EI5実験より前に同ビームラインで行うことを提案

まとめ

- - ▶ I)オプティカルポテンシャルの深さ、2)K中間子原子核の存在、 に関する重要な情報
 - ▶ K-原子核間 強相互作用のアイソスカラー / ベクターに関する新た な知見
- - ▶ EI5実験の共有部分の開発
 - ▶ X線検出器系の改良
 - ▶ ビームライン検出器群設計

backup

E570における主な系統誤差の原因

Energy [eV]

応答関数
 (低エネルギー側のテール)
 「デール強度のエネルギー依存性
 「「Ka NiKaはTiKa Ni Ka
 O-2倍
 のーン・

2. コンプトン散乱効果





系統誤差を抑えるための対策

- Ⅰ. 応答関数 (テール強度のエネルギー依存性) 及び、 エネルギー線形性
 - ➡ 大強度のπビームを用いて、3点以上のキャリブレー ションラインを高統計で測定 …短時間で測定可能
- 2. コンプトン散乱効果
 - → ³He 及び ⁴He標的両方のデータを取得(?)→"双方シ フトの差"においては、大部分の系統誤差を相殺





⇒ エネルギー依存の応答関数

⇒ エネルギー線形性

ガス標的?

◎ 利点:コンプトン散乱効果を大幅に低減可能

- - ➡ 全SDDに対する高統計のエネルギー較正が困難
 - ➡ 全SDDに対する(パイルアップ除去等の為の)FADC データ収集は非現実的